Searcn Notes					

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/813,932	SCHROER, DAN J.
Examiner	Art Unit
 John J. Park	2876

SEARCHED					
Class	Subclass	Date	Examiner		
235	380				
235	382				
235	375				
235	379				
235	487				
700	2		·		
283	75	2/10/2005	JP		
		•			
	Œ.				

INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
			:	

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)		
	DATE	EXMR
EAST		
Text Search		
Consulted with S. Paik in AU 2876	2/10/2005	JP